



► **EINLADUNG**

15. Technologie- und Expertenkongress

**6. März 2012**  
**Swissôtel Zürich**

**Jetzt anmelden und  
Teilnahme sichern!**

Faxformular auf der Rückseite



Aktuelle Informationen zum Kongress finden Sie auf Ihrer persönlichen Website:  
[ni.com/switzerland/nidays](http://ni.com/switzerland/nidays)

## Chancen erkennen – und konsequent nutzen



### Herzlich willkommen zu den 15. NIDays 2012!

Wie soll man reagieren, wenn man von allen Seiten laufend mit dem Thema „Krise“ konfrontiert wird? Einstimmen in Wehklagen, Trübsal blasen, resignieren und sich mit dem Schicksal abfinden? Leider sehen wir diese Reaktionen nur allzu oft.

Wenn wir ehrlich sind, stelle sich uns allerdings die Frage: Gab es wirklich einmal eine einfache Zeit? Jede Epoche hatte ihre Herausforderungen, jedoch gab es immer auch Chancen. Für den Werkplatz Schweiz ist es entscheidend, die sich bietenden Chancen und die Stärke des Standortes konsequent zu nutzen. Das geschieht jedoch selten im „stillen Kämmerlein“, sondern im Dialog mit Kollegen und Fachleuten – besonders, wenn diese aus anderen bzw. branchenfremden Bereichen kommen. Exakt hier setzt der NIDays-Kongress an.

Denn hier treffen Sie auf innovative Ingenieure, Wissenschaftler und Forscher aus den unterschiedlichsten Fachbereichen. Damit bieten wir Ihnen die ideale Plattform, um Erfahrungen auszutauschen, Neues zu lernen und sich wertvolle Inspirationen zu holen.

Der Wissensstandort Schweiz braucht diesen Dialog, um sich für die Zukunft zu rüsten. Dabei geht es darum, nicht mehr, sondern effizienter und intelligenter zu arbeiten, sich auf zukunftssträchtige Wachstumsbereiche auszurichten und durch Innovationen mit Swissfinish in Führung zu gehen.

Ausschlaggebend ist hier, die Produktivität zu steigern und Innovationszyklen zu verkürzen. Sprich: Forschungsergebnisse schneller am Markt umzusetzen. Das NI Swiss Startup Program, welches wir dieses Jahr ins Leben gerufen haben, bringt diese Aspekte auf den Punkt: Entdecken Sie, wie sich junge Unternehmen in Rekordzeit am Markt etablieren und mit Innovationen neue Werte schaffen konnten. In diesem Sinne schlagen wir an den NIDays die Brücke von der Spitzenforschung am CERN über die Hochschulen bis hin zur Industrie.

Dies und viele neue Ideen, Impulse und Technologien bieten Ihnen die NIDays 2012. Ich freue mich darauf, auch Sie in diesem exklusiven Expertenkreis begrüßen zu dürfen.

Christian Moser  
Managing Director NI Switzerland

## Keynotes: Einsichten, die unser Bild der Welt verändern

→ Von den jüngsten Entwicklungen in der experimentellen Grundlagenforschung zu brandaktuellen Innovationen im Graphical System Design: Die Keynotes der NIDays 2012 richten den Fokus auf revolutionäre Fortschritte in Wissenschaft und Anwendung.

### 🕒 09:00-10:00 Das Forschungszentrum CERN: Von den höchsten Energien zu den kleinsten Teilchen

**Prof. Dr. Rolf-Dieter Heuer,  
Generaldirektor CERN, Genf**

Die moderne Elementarteilchenphysik beschäftigt sich mit der Suche nach den kleinsten Bausteinen der Natur und nach den Kräften, mit denen sie in Wechselwirkung stehen. Zu diesem Zweck werden am CERN Zustände nachgestellt, wie sie im frühesten Universum stattgefunden haben.

Mit dem Start des Large Hadron Colliders (LHC) am CERN beginnt eine neue Ära der Teilchenphysik. Der LHC wird ein tieferes Verständnis der Vorgänge im Universum liefern und hat das Potenzial, unser Weltbild zu revolutionieren. Wir erwarten tiefgreifende Erkenntnisse über den Aufbau

und Ursprung der Materie, der Natur der Dunklen Materie und vielleicht über die Existenz zusätzlicher Raumdimensionen. Prof. Heuer, Generaldirektor am CERN, stellt das Forschungszentrum vor und vermittelt Ihnen einen Eindruck vom faszinierenden Physikpotenzial des LHC – einschliesslich der wichtigsten Ergebnisse der ersten Datennahme. Der LHC wird mit Hilfe von mehreren 100 PXI-Systemen gesteuert. Sie sorgen dafür, dass Teilchen, die aus dem Kern des Strahls austreten, absorbiert werden. Mit LabVIEW Real-Time und LabVIEW FPGA werden entlang des 27 km langen Beschleunigers ca. 600 Motoren auf die Millisekunde genau synchronisiert.



Prof. Dr. Rolf-Dieter Heuer

### 🕒 10:00-11:00 New Product & Technology Introduction

In dieser Keynote öffnen wir den Vorhang zum R&D-Center. Wir präsentieren Ihnen mit zahlreichen Kollegen aus unterschiedlichen, weltweit verteilten R&D-Zentren von National Instruments neueste Produkte

und Technologien sowie alles über das NI-Konzept des Graphical System Designs. Entdecken Sie im Rahmen von Live-Demonstrationen die aktuellen Technologietrends und gewinnen Sie spannende

Einblicke in die Produktentwicklung von NI. Das Anwendungsspektrum umfasst die industrielle Mess- und Prüftechnik, automatisierte Tests, Steuer- und Regeltechnik sowie Embedded Control & Monitoring.

## Vortragsreihen: Gebündeltes Know-how aus erster Hand <sup>(1)</sup>

→ Von Experten für Experten: Profitieren Sie vom umfassenden Know-how erfahrener Entwickler, Anwender und NI-Ingenieure.



### Software Development Techniques

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert revolutioniert NI LabVIEW die Mess- und Prüftechnik. Die kontinuierlichen Weiterentwicklungen der vergangenen Jahrzehnte haben LabVIEW zu einer ausgereiften, vollwertigen Engineering-Plattform geformt. In dieser Vortragsreihe präsentieren Ihnen NI-Experten und LabVIEW Power User geballtes Wissen rund um das Thema Software Engineering. Schwerpunkte sind u. a. die Leistungs- und Geschwindigkeitsoptimierung sowie das Speichermanagement in Softwareprojekten.

### Industrial Measurement & Control

Kostenminimierung durch innovatives und effizientes Engineering: ein heiss diskutiertes Thema im gesamten Bereich der industriellen Mess-, Prüf- und Regelungstechnik. Dementsprechend haben sich auch die hier eingesetzten Systeme in den letzten Jahren stark verändert und müssen immer höhere Ansprüche an Leistungsfähigkeit und Funktionsvielfalt erfüllen. In diesem Track zeigen wir Ihnen, wie Anwender diesen Herausforderungen begegnen, z. B. mit der FPGA-basierten Industriepattform NI CompactRIO – und dabei immer wieder im Stande sind, die wachsenden Anforderungen zu erfüllen.

### Industrial Data Acquisition & Signal Conditioning

Als Marktführer im Bereich softwarebasierte Messgeräte integriert National Instruments laufend neue Technologien und Trends in sein breites Produktspektrum. So sind wir in der Lage, Anwendern immer neue Einsatzgebiete und Lösungen zu eröffnen. In dieser Vortragsreihe demonstrieren Ihnen Anwender, wie sie sich das Engagement von NI für ihre individuellen Anforderungen erfolgreich zunutze machen. Anhand aktueller Produkte aus der Messtechnik vermitteln sie Ihnen wertvolle Einblicke in die permanente Weiterentwicklung dieses Bereichs.

### Automated Test & Measurement

In den letzten Jahren haben zahlreiche neue Technologien den Bereich der automatisierten Prüfsysteme revolutioniert. Nun gilt es, diese in bestehende Prüfstandskonzepte zu integrieren und neue leistungsfähigere Standardsysteme zu realisieren. Erfahren Sie anhand anschaulicher Beispiele aus den unterschiedlichsten Industriebereichen, wie Sie modulare, softwaredefinierte Prüfsysteme mit höherem Durchsatz und verbesserter Flexibilität zu geringeren Gesamtkosten erstellen. Ausserdem demonstrieren wir Ihnen die besten Verfahrensweisen für die Entwicklung effizienter Prüfsysteme.

### Real-Time Testing & HIL Simulation

Die zunehmende Komplexität und Leistungsfähigkeit von Embedded-Systemen stellt immer höhere Anforderungen an Spezifikation, Anwendungsentwicklung und deren Testumgebungen. Das Graphical System Design bietet hier optimale Lösungen. Dabei deckt es den gesamten Produktentstehungszyklus ab – von der Anforderungsdefinition über die Simulation und das Rapid Prototyping bis hin zum konfigurierten, automatisierten Echtzeittestsystem. In diesem Track lernen Sie Werkzeuge und Vorgehensweisen zur Bewältigung der steigenden Anforderungen kennen – und können Ihr Wissen im Rahmen eines praxisorientierten Workshops vertiefen.

	📍 Zürich	📍 Basel	📍 Bern	📍 Genf/Montreux	📍 St. Moritz	📍 Arosa	📍 Davos
08:15-09:00	<b>Registrierung</b>						
09:00-10:00	<b>Begrüssung &amp; Keynote</b>						
10:00-11:00	<b>New Product &amp; Technology Introduction</b>						
🕒 11:00-11:30	<b>Kaffeepause/Besuch der Ausstellung</b>						
	Software Development Techniques	Industrial Measurement & Control	Industrial Data Acquisition & Signal Conditioning	Automated Test & Measurement	Innovations Track	Technical Data Management	Real-Time Testing / HIL Simulation
11:30-12:00	<b>The LabVIEW Compiler and Memory Management Techniques</b> Elijah Kerry, National Instruments Corp. Christian Mergl, National Instruments Germany GmbH (engl./dt.)	<b>What is and what's new in CompactRIO</b> Nicolas Pasquier, National Instruments Switzerland Corp. (frz.)	<b>Modern DAQ Architectures</b> Andreas Scholz, National Instruments Germany GmbH (dt.)	<b>Automated Test Outlook 2012 - Trends and Vision</b> Charles Schroeder, National Instruments Corp. (engl.)	<b>Swiss Startup-Program</b> Oliver Bruder, National Instruments Switzerland Corp. (dt.)	<b>What's New in DAdem 2011</b> Walter Rick, National Instruments Engineering GmbH & Co. KG (dt.)	<b>HIL Simulation and Real-Time Testing Techniques</b> Stephan Ahrends, National Instruments Germany GmbH (dt.)
12:00-12:30	<b>Manufacturing Execution Systems with LabVIEW</b> Beat Liesch, TRUMPF Laser Marking Systems AG (dt.)	<b>Measurement System for Executing Dynamic Type Tests on the Brake System of Railway Vehicles</b> Daniel Leibundgut, Schweizerische Bundesbahnen SBB (dt.)	<b>Test Benches for Determining the Energy Properties of Water Reservoirs</b> Markus Ströhle, gbd LAB GmbH (dt.)	<b>Coffee Makers on the Test Bench</b> Alessandro Sebaste, Noser Engineering AG (dt.)	<b>High-Performance Position Control in the Nanometer Range on an NI CompactRIO System for Testing Medical Implants</b> Dr. Thorsten Schwenke, Theikin GmbH, Alain von Ritter, Sotronic GmbH	<b>Using NI DAdem for Validating Reference Software According to the IEC 61083-4 Standard</b> Marco Mailand, ABB Schweiz AG (dt.)	<b>Automating the Test Bay for Component Tests in the Automotive Industry with Adaptive Controllers</b> Sönke von Heymann, ThyssenKrupp Presta Steering Hans-Georg Hermann, ExpertControl GmbH (dt.)
🕒 12:30-14:30	<b>Mittagspause/Besuch der Ausstellung</b>						
	Engineering Challenges of Mankind				Certifications		
12:30-13:15	<b>Graphical System Design in Embedded-Bereich</b> Marco Schmid, Schmid Elektronik AG (dt.)		<b>Advanced Control of the Future Electrical Infrastructure</b> Prof. Dr. Mario Paolone, EPFL (engl.)			CLAD 12:30-13:45	
13:45-14:30		<b>Life Sciences: From Lab to Market - Accelerating Life Sciences Instrumentation and Medical Devices Design and Test</b> John Hanks, National Instruments Corp. (engl.)		<b>KTI: Switzerland as a Center of Innovation</b> Walter Steinlin, Kommission für Technologie und Innovation (dt.)			CLAD 13:15-14:30
	Software Development Techniques	Industrial Control Solutions	Industrial Data Acquisition & Signal Conditioning	Automated Test & Measurement	Innovations Track	Advanced Measurements	Real-Time Testing / HIL Simulation
14:30-15:00	<b>Improve the Performance of your LabVIEW Projects</b> Christian Mergl, National Instruments Germany GmbH (dt.)	<b>Making the Move to NI LabVIEW Real-Time and FPGA Programming</b> Joseph Tagg, National Instruments Switzerland Corp. (dt.)	<b>Network Communication with LabVIEW</b> Daniel Riedelbauch, National Instruments Germany GmbH (dt.)	<b>What is New in PXI Automated Test?</b> Evrem Yarkin, National Instruments Switzerland Corp. (dt.)	<b>Skope MR Technologies</b> Dr. Christoph Barmet	<b>Overcoming High Speed Analog Measurement Challenges with up to 12.5 GS/s</b> Marco Brauner, National Instruments Germany GmbH (dt.)	<b>Developing Distributed Stand-alone Real-Time Applications with the CompactRIO Hardware Platform</b> Luca Pretto, National Instruments Switzerland Corp. (dt.)
15:00-15:30	<b>Cable Fault Detection with Artificial Intelligence</b> Dr. Stefan Messmer, IWM AG (engl.)	<b>Control of a Novel Remote-Center-of-Motion Parallel Manipulator for Surgical Robots</b> Ali Sengül, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (engl.)	<b>Distributing Branched Signal Processing Pipelines over Several Computers Using LabVIEW Web Services and Network Streaming Queues: a Flexible Framework that Supports Remote Scripting</b> Dominik Langer, Marcel van 't Hoff Brain Research Institute, University of Zurich (dt.)	<b>Realization of a „Universal“ Functional Tester for Electronic Boards</b> Michael Lys, Bobst SA (engl.)	<b>Qualisense</b> Dr. Francesco Dell'Endice Dr. Lijin Aryananda	<b>IP to the Pin - FPGA-based Applications Using NI FlexRIO</b> Christoph Landmann, National Instruments Germany GmbH (dt.)	
🕒 15:30-16:00	<b>Kaffeepause/Besuch der Ausstellung</b>						
	Software Development Techniques	Industrial Measurement & Control	Industrial Data Acquisition & Monitoring	Automated Test & Measurement Focus: RF Measurements & Spectral Monitoring	Innovations Track	Environmental Measurements	Real-Time Testing / HIL Simulation
16:00-16:30	<b>What You Should Know When Building User Interfaces in LabVIEW</b> Vincenzo Maria, National Instruments Switzerland Corp. (dt.)	<b>Fundamentals of Motion Control with LabVIEW</b> Christian Mergl, National Instruments Germany GmbH, Alexander Rudolph, National Instruments Switzerland Corp. (dt.)	<b>The Future of Condition Monitoring: Prognostics Systems Using COTS Technologies</b> Lodovico Menozzi, National Instruments Italy (engl.)	<b>Realizing Benefits of Software-Defined RF Tests</b> Christian Gindorf, National Instruments Germany GmbH (dt.)	<b>nanotion AG</b> Bartjan den Hartogh Dr. Christopher Latkoczy	<b>Wireless Sensor Networks</b> Sascha Egger, Francesco Spadafora National Instruments Switzerland Corp. (dt.)	<b>Real-Time Testing with NI VeriStand</b> Andreas Stark, National Instruments Germany GmbH (dt.)
16:30-17:00	<b>Guidelines for NI LabVIEW Applications</b> Amadeo Vergés, Zühlke Engineering AG (dt.)	<b>A 100 kW Pilot Solar Plant Controlled by cRIO and Softmotion</b> Yvonne Bäuerle, Solar Technology Laboratory, Paul Scherrer Institut (dt.)	<b>Networked Acquisition of Measurement Data for Component Tests of Gas Turbines</b> Otto Gansner, PI Electronics AG (dt.)	<b>Combining Different Test Technologies in PXI for Maximum Coverage (JTAG, Functional Test, In-Circuit-Test)</b> Matthias Vogel, Konrad Technologies (dt.)	<b>SPECS Zurich GmbH</b> Dr. Alessandro Pioda Daniel Uehli		
17:00-17:30	<b>LabVIEW FPGA under the Hood</b> Joseph Tagg National Instruments Switzerland Corp. (dt.)	<b>Practical Realization of Smart Acoustic Materials by Controlling a Loudspeaker with the Help of a cRIO Platform</b> Etienne Rivet, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (engl.)	<b>Power Measurements Fundamentals</b> Vidar Gronas, National Instruments Norway, Alexander Rudolph, National Instruments Switzerland Corp. (engl.)	<b>Optimizing DC Measurements</b> Nicolas Pasquier, National Instruments Switzerland Corp. (engl.)	<b>PXI for Structural Measurements</b> Lodovico Menozzi National Instruments Italy (engl.)		<b>Real-Time Simulation of Inverters and Electrical Motors</b> Andreas Stark, National Instruments Germany GmbH (dt.)
🕒 17:30-18:30	<b>Apéro/Besuch der Ausstellung</b>						

## Vortragsreihen: Gebündeltes Know-how aus erster Hand <sup>(2)</sup>

### Technical Data Management

Kürzere Produktzyklen, hoher Qualitätsanspruch und innovatives Design gehen während der Produktentwicklung Hand in Hand mit umfangreichen Tests auf Basis leistungsfähiger Hard- und Software. Die Auswertung der Messergebnisse muss damit Schritt halten können. Denn eine zeitnahe Bereitstellung kann schliesslich nur durch entsprechende Werkzeuge erreicht werden. Dieser Track stellt neue Funktionen und Konzepte zum technischen Datenmanagement vor, um in den entscheidenden Bereichen von Datenorganisation, Auswertung und Berichterstellung Schritt halten zu können.

### Advanced Measurements

Monolithische Messsysteme mit fester Funktionalität sind inzwischen fast vollständig von PC-basierten, softwaredefinierten Systemen abgelöst worden. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der FPGA-Technologie, die Anbindung an leistungsstarke Backplane-Busse wie PXI Express und heterogene Verarbeitungsstrategien gewinnen in diesem Bereich zunehmend an Bedeutung. In dieser Vortragsreihe zeigen wir Ihnen Highlights aus dem Bereich der softwarebasierten, modularen Messtechnik.

### Environmental Measurements

Die Sicherheit, Überwachung und Erhaltung ziviler Infrastrukturen rund um den Globus hängen zu einem Grossteil von strukturellen Tests und Anwendungen für das Structural-Health-Monitoring (SHM) ab. Hier erhalten Sie einen Überblick zu aktuellen Trends und Schlüsseltechnologien im Bereich der strukturellen Tests. Im Workshop zum Thema Wireless Sensor Networks erleben Sie ausserdem, wie drahtlose dezentrale Sensornetzwerke zum Schutz der zivilen Infrastruktur beitragen.

### Special Highlight: Innovationsförderung mit dem NI Swiss Startup Program

Ein Grossteil der bedeutendsten Innovationen in Wissenschaft und Technik ging von kleinen, kreativen Technologieunternehmen aus. Um die Projekte solcher Unternehmen zu fördern, hat National Instruments Switzerland ein Programm ins Leben gerufen, das Schweizer Unternehmen, die den Einsatz von Technologien (Graphical System Design) von National Instruments planen, umfangreich bei der Erstellung komplexer Systeme für Industrie oder Wissenschaft unterstützt. Ziel des Programms ist es, diese Jungunternehmer zügiger auf ihren Eintritt in den wettbewerbsorientierten Markt vorzubereiten und so ihre Chancen auf Erfolg und eine schnelle Akzeptanz auf den Märkten zu erhöhen.

Im Innovations Track stellen aktuelle und ehemalige Schweizer Startup-Unternehmen reale Beispiele vor, wo mit Hilfe von Graphical System Design Ideen aus der Forschung zu industriellen, marktfähigen Produkten umgesetzt und kommerzialisiert wurden.



### Dolmetscher-Service

Auch in diesem Jahr stellen wir Ihnen gerne unseren Dolmetscher-Service zur Verfügung. So können Sie die Keynote und die Vorträge in den Räumen Basel und Bern via Simultanübersetzung in Ihrer Muttersprache verfolgen.

Bitte hier aufklappen!

# Specials:

## Damit sich Ihr Besuch in jeder Hinsicht lohnt

→ Wie jedes Jahr bieten wir Ihnen auch 2012 eine ganze Reihe ergänzender Angebote und Services, um Ihren Besuch so gewinnbringend und angenehm wie möglich zu gestalten.

### Ausbildner- und Dozententag

Parallel zum NIDay findet auch dieses Jahr wieder ein Ausbilder- und Dozententag statt. Informieren Sie sich über gegenwärtige und zukünftige Trends in Ausbildung und Lehre und tauschen Sie sich mit anderen Teilnehmern aus diesen Bereichen über spannende Projekte und innovative Ideen aus.

Raum	Saas Fee/Zermatt
Agenda	Ausbildner- & Dozententag
11:30-12:00	Ich und Naturwissenschaften? – Zwei getrennte Welten! Dr. Michael Junge, Swiss Science Center Technorama
12:00-12:30	Neues für die Bildung, National Instruments Switzerland Corp.
12:30-13:00	Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der universitären Physikausbildung Urs Lauterburg, Uni Bern
13:00-14:00	Mittagspause
14:00-14:30	Mechatronik in der Ausbildung - von Lego Mindstorms zu LabVIEW Robotics Sascha Egger, National Instruments Switzerland Corp.
14:30-14:50	Do Engineering with NI-ELVIS at School Didier Barth, Haute Ecole Arc
14:50-15:10	Erfahrungen mit LV Robotics und der DaNI-Plattform Roland Anderegg, FHNW
15:10-15:30	Kaffeepause
15:30-16:00	NI ELVIS the Troubleshooter, Alfred Albisser, Lukas Klier, PSI
16:00-17:00	Workshop-Einsatz vom NI ELVIS mit Multisim und LabVIEW Beat Schib, National Instruments Switzerland Corp.

### CLAD-Zertifizierung

Im Rahmen des Kongressbesuchs haben Sie die Möglichkeit, kostenfrei an der CLAD-Zertifizierung (Certified LabVIEW Associate Developer) teilzunehmen. Zertifizierungen unterstreichen Ihre technischen Kenntnisse und Fähigkeiten. Somit sind Sie für grosse Herausforderungen bestens gerüstet und verfügen durch das industrieweit anerkannte Zertifikat über eine optimale Referenz und einen Qualitätsnachweis.



**Nutzen Sie Ihren Besuch des NIDays, um sich Ihre Zertifizierung schnell und einfach zu sichern!**

### Lunch Sessions: Engineering Challenges of Mankind

Graphical System Design	Life Sciences	Electrical Infrastructure	KTI
Graphical System Design im Embedded-Bereich	From Lab to Market - Accelerating Life Sciences Instrumentation and Medical Devices Design and Test	Advanced Control of the Future Electrical Infrastructure	Innovationsstandort CH
Marco Schmid, Schmid Engineering (dt.)	John Hanks, National Instruments Corp. (engl.)	Prof. Dr. Mario Paolone, EPFL (engl.)	Walter Steinlin, Kommission für Technologie und Innovation (dt.)
Raum Zürich	Raum Basel	Raum Bern	Raum Genf/Montreux
12:30-13:15	13:45-14:30	12:30-13:15	13:45-14:30

# Ausstellung:

## Networking im exklusiven Rahmen

→ In der kongressbegleitenden Ausstellung präsentieren Produktpartner und Systemintegratoren aktuelle Anwendungen, Lösungen und Produkte. Nutzen Sie diese Chance, um sich über neueste Entwicklungen zu informieren, interessante Kontakte zu knüpfen und potenzielle Geschäftspartner kennenzulernen.

**Ausstellungszeit**  
08:00-18:30

#### ad+t AG

Ihr Partner für Testsystemlösungen – unser Spektrum reicht von In-Circuit-Test, Flying Probe Test, JTAG/Boundary Scan Test, AOI/AXI-optische Inspektion, Funktionstestsystem bis hin zu Multimode-Testsystemen. [adt.ch](http://adt.ch)

#### ARCALE

Serviceleistungen im Bereich Mess- und Prüftechnik. Wir unterstützen Sie von der Konzepterstellung über die Durchführung bis hin zur Wartung von Prüfständen oder Maschinen. [arcale.net](http://arcale.net)

#### a-solution

a-solution liefert technisch kompetente DIAdem- und LabVIEW-Komplettlösungen im Bereich Mess- und Prüfstandstechnik, Datenhaltung und -auswertung. [a-solution.de](http://a-solution.de)

#### GMP SA

Seit 1977 ist GMP in den Bereichen Laser, Spektroskopie, Photonik und Mikropositionierung spezialisiert. GMP verfügt über ein effizientes Verkaufs- und Serviceteam und erfüllt nicht nur die wichtige Rolle des Vertreters von beratungsintensiven Hochtechnologieprodukten, sondern bietet auch kundenspezifisch entwickelte Systeme an. [gmp.ch](http://gmp.ch)

#### Helbling Technik AG

“Innovation, together we do it.” Mit dieser Vision positioniert sich Helbling Technik als langfristiger Partner im Innovationsnetzwerk des Kunden. [helbling.ch](http://helbling.ch)

#### Konrad GmbH

Das Unternehmen entwickelt, fertigt und integriert kundenspezifische Testsysteme für die Elektronikfertigung. Technologien: FKT, ICT, AOI, HF, Halbleiter und Softwarelösungen. [konrad-technologies.de](http://konrad-technologies.de)

#### maxon motor ag

Weltweit führender Anbieter von hochpräzisen Antriebssystemen bis 500 Watt: DC- und EC-Motoren, Getriebe, Istwertgeber, Servoverstärker, Positioniersteuerungen und CIM/MIM-Komponenten. [maxonmotor.com](http://maxonmotor.com)

#### National Instruments

Pionier der Technologien rund um die Mess- und Automatisierungstechnik und um das Konzept der virtuellen Instrumente – für höhere Leistung bei gesenkten Kosten. [ni.com](http://ni.com)

#### Noser Engineering

Noser Engineering AG realisiert seit über 25 Jahren vielseitiges Software-Engineering und System-Testing für anspruchsvolle Kunden. [noser.com](http://noser.com)

#### PI Electronics AG

Wir reden nicht nur, wir tun was. PI Electronics ist Ihr innovativer Partner für erfolgreiche Hard- und Softwareprojekte. Lernen Sie uns kennen! [pie.ch](http://pie.ch)

#### Schmid Elektronik AG

Ein Lösungsanbieter für Deeply Embedded Systems. Hardware, Software, Tools und Services ermöglichen es, LabVIEW in der Welt der Mikroprozessoren (Blackfin/ARM) einzusetzen. [schmid-elektronik.ch](http://schmid-elektronik.ch)

#### Sotronik GmbH

Wo die kreativsten Menschen am liebsten nachdenken. Software und Elektronik für industrielle Automation, Steuern, Regeln und Simulieren. [sotronik.ch](http://sotronik.ch)

#### Zühlke Engineering AG

Die Innovations- und Umsetzungskraft eines Unternehmens entsteht aus der Verbindung des Geschäfts mit Menschen und Technik. Zühlke Engineering stellt diese Verbindung her, durch wegweisende Produkte, maßgefertigte Software und kombinierte Lösungen. [zuehlke.com](http://zuehlke.com)

Stand Dezember 2011

Medienpartner:



# Anmeldung zur Teilnahme am Kongress

Bitte ankreuzen und mit Anschrift des Teilnehmers vollständig ausgefüllt **per Fax** an National Instruments schicken: **+41 56 2005155**

Bitte wählen Sie aus, woran Sie teilnehmen möchten:

- NIDays-Kongress**       **Ausbildner- und Dozententag (inkl. NIDays-Kongress)**

Bitte wählen Sie Ihren Tarif:

- Frühbucherpauschale**      **CHF 195.-** zzgl. MwSt. bei Anmeldung bis 3. Februar 2012  
 **Tagungspauschale**      **CHF 245.-** zzgl. MwSt. bei Anmeldung ab 4. Februar 2012  
 **Gruppenticket** Melden Sie 3 Personen zu den NIDays an, erhalten Sie eine 4. Kongressteilnahme kostenlos.  
**CHF 585.-** zzgl. MwSt. bei Anmeldung bis 3. Januar 2012  
**CHF 735.-** zzgl. MwSt. bei Anmeldung ab 1. Februar 2012

Bitte geben Sie Name, Vorname und E-Mail-Adresse aller angemeldeten Personen an:

Name, Vorname, E-Mail: \_\_\_\_\_

Name, Vorname, E-Mail: \_\_\_\_\_

Name, Vorname, E-Mail: \_\_\_\_\_

Name, Vorname, E-Mail: \_\_\_\_\_

- Studentenpauschale**      **CHF 50.-** zzgl. MwSt.  
für Studenten (Kopie der Legi mitschicken); ausgenommen sind Personen, die nebenberuflich einer Weiterbildung nachgehen  
 **CLAD-Zertifizierung**      **Kostenlos** (nur in Verbindung mit einer Kongressteilnahme möglich)

Herr    Frau

Name, Vorname: \_\_\_\_\_ Firma/Abteilung: \_\_\_\_\_

Strasse/Hausnummer: \_\_\_\_\_ PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Rechnungsadresse (falls abweichend) \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Datum, Ort: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
 rechtsverbindliche Unterschrift/Firmenstempel

**Leistungen:** Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am eintägigen Kongress NIDays 2012, eine Kongresstasche und Verpflegung.

**Rücktritt:** Ihre Anmeldung gilt als verbindlich. Bis 3. Februar 2012 ist der kostenlose Rücktritt von der Teilnahme an den NIDays 2012 möglich.

**Dieser muss NI schriftlich mitgeteilt werden.** Nach diesem Datum gelten folgende Rücktrittsbedingungen:

**Stornierung bis 17. Februar 2012: 50 % der Teilnahmegebühr, ab 18. Februar 2012: 100 % der Teilnahmegebühr**

## Veranstaltungsort

Swissôtel Zürich  
Am Marktplatz Oerlikon  
Schulstrasse 44, 8050 Zürich  
www.swissotel.com

## Veranstalter

National Instruments Switzerland Corp. Austin,  
Zweigniederlassung Ennetbaden  
Sonnenbergstrasse 53, 5408 Ennetbaden  
Tel.: +41 56 2005151  
Fax: +41 56 2005155  
E-Mail: ni.switzerland@ni.com



Sämtliche Informationen zum Kongress finden Sie auch unter [ni.com/switzerland/nidays](http://ni.com/switzerland/nidays)